

MD100N

分光輝度計



規格

光譜		
感測器	CMOS 線性感測器	
光譜波長範圍	380 to 780 nm	
波長資料間隔	1 nm	
光譜波寬	約 9 nm (半波寬)	
量測區域	Ø 10 mm	
受光角度	±1°	
波長再現性	± 1 nm	
量測範圍	0.001 to 5000 cd/m ²	
亮度 ^{*1*2}	測量範圍	0.05~5000 cd/m ²
	精度	±2% 100 to 5000 cd/m ²
		±3% 0.2 to 100 cd/m ²
		±4% 0.05 to 0.2 cd/m ²
	重複性 (2σ) ^{*3}	0.2% 100 to 5000 cd/m ²
		0.5% 0.2 to 100 cd/m ²
		0.8% 0.05 to 0.2 cd/m ²
色度 ^{*1*2}	測量範圍	0.05~5000 cd/m ²
	精度	±0.002 in CIE1931 x, y for white 100 to 5000 cd/m ² ±0.003 in CIE1931 x, y for white 0.2 to 100 cd/m ² ±0.005 in CIE1931 x, y for white 0.05 to 0.2 cd/m ²

	重複性 (2σ) ^{*3}	0.0005 in CIE1931 x, y for white 100 to 5000 cd/m ² 0.001 in CIE1931 x, y for white 0.2 to 100 cd/m ² 0.002 in CIE1931 x, y for white 0.05 to 0.2 cd/m ²
雜散光	-25 dB max ^{*4}	
偏極化誤差	<2%	
積分時間	100us to 5000 ms （快速模式/一般模式）	
數位解析度	16 bits	
頻閃		
測量範圍	5 to 5000cd/m ²	
取樣速度	100k sample/sec (adjustable)	
對比度	精度	±1% (30Hz AC/DC 10% 正弦波) ±2% (60Hz AC/DC 10% 正弦波)
	重複性	1% (20 to 65 Hz AC/DC 10% 正弦波)
	JEITA	精度 重複性
特點		
量測功能	單次 / 連續	
操作模式	RS232 模式 / USB 模式 (PC 連接)	
積分時間	自動 / 手動	
暗校正	自動	
光譜量測項目	1. 亮度 (cd/m ²)	
	2. 相關色溫 (CCT)	
	3. C.I.E 色度座標圖 (1) CIE 1931 2-degree, 10-degree x,y Coordinates (2) CIE 1976 2-degree, 10-degree u',v' Coordinates (3) CIE 1931 XYZ Value	
	4. Δx, Δy, Δu', Δv'	
	5. Delta uv (Duv)	
	6. 主波長 (λd)	
	7. 色純度 (Excitation Purity)	
	8. 演色指數 (CRI, Ra) / R1 to R15	
	9. 光譜功率分佈 (SPD) mW/m2	
	10. 峰值波長 (λp)	
	11. 峰值強度 (λpV)	
	12. 積分時間 (I-Time)	
	13. 暗明视觉比 (S/P)	
頻閃量測項目	1. Max / Min, Average, RMS and Frequency	

	2. JEITA
	3. VESA
	4. 頻閃百分比 (Percent Flicker)
	5. 頻閃指數 (Flicker Index)
系統配置	
電源	變壓器 5V, 1.0A
接口	RS232 ; USB 2.0
尺寸	204 x 90 x 45 mm (長 x 寬 x 高)
重量	630 g $\pm$ 10 g
操作溫度 / 濕度	0 to 35 $^{\circ}$ C · 相對濕度 70%或以下 · 無冷凝
儲存溫度 / 濕度	-10 to 40 $^{\circ}$ C · 相對濕度 70%或以下 · 無冷凝
軟件	SDK Solution (Windows platform), uSPECTRUM, uFLICKER

*1：在標準光源下(2856K、6500K & 9300K)進行亮度及色度測試。

*2：在溫度 23 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C · 相對濕度 50%以下進行亮度及色度測試。

*3：在快門長開的狀態下 · 進行重複性測試。

*4：使用 550nm 單頻光輸入與量測 550nm $\pm$ 40nm 位置的量測比例值。

本公司保有產品規格變更之權利 · 如有變更 恕不另行通知。